

## **Анализ метрологического обеспечения нанотехнологий на основе перечня измерительных потребностей и возможностей российской наноиндустрии**

В.А. Демин, П.А. Форш, А.С. Воронцов, П.К. Кашкаров  
ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1

В настоящее время в Российской Федерации благодаря усилиям участников национальной нанотехнологической сети (ННС) и различным мероприятиям, в том числе федеральным целевым программам, накоплен большой задел для развития наноиндустрии. Эффективное развитие российской наноиндустрии требует создания и совершенствования адекватной системы метрологического обеспечения нанотехнологий и продукции на их основе. В свою очередь, потребности в метрологическом обеспечении диктуют необходимость проведения анализа измерительных потребностей и калибровочных возможностей российской наноиндустрии.

В данной работе проводится анализ консолидированной информации об актуализированных измерительных потребностях и возможностях организаций наноиндустрии с использованием информационно-аналитической системы (ИАС), являющейся частью системы мониторинга измерительных потребностей и возможностей в сфере нанотехнологий в Российской Федерации. Показаны возможности автоматизированного формирования аналитических отчетов на основе данных, классифицированных по специальным рубрикам в соответствии с установленной методикой и загруженных в хранилище ИАС. Отчеты представляют собой информационные выборки баз данных в различных разрезах гиперкуба как многомерной модели организации данных – по разным тематическим направленностям анализируемой информации.

На основе анализа текстовых и графических отчетов, предоставляемых ИАС, сформированы выводы о состоянии метрологического обеспечения наноиндустрии в Российской Федерации и предложены потенциальные способы развития измерительных возможностей предприятий ННС и других организаций наноиндустрии.